

BIBLIOGRAFÍA

- Cheng D. (1998), Fundamentals of Engineering Electromagnetics (2ª Ed.), New Jersey, NJ: Prentice Hall.
- Proakis G. y Manolakis D.G. (1998), Tratamiento Digital de Señales (Principios, Algoritmos y Aplicaciones) (3ª Ed.), New Jersey, NJ: Prentice Hall.
- White J. (2004), High Frequency Techniques: An Introduction to RF and Microwave Engineering (1ª Ed.), Hoboken, NJ: Wiley-IEEE Press.
- Fantom A. (1990), Radio Frequency & Microwave Power Measurement, Hertfordshire, Reino Unido: IET.
- Tim Willams (2007), EMC for Product Designers (4ª Ed.), Oxford, Reino Unido: Newnes.

Unidad Temática 1: Conceptos de mediciones en alta frecuencia

- Henze A. (2011), Transferencia de Potencia, Buenos Aires: INTI.

Unidad Temática 2: Conectores y cables coaxiales

- Henze A. (2011), Conectores de RF y Microondas, Buenos Aires: INTI.
- Ceconi J. (2011), Conectores Coaxiales, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Skinner D. (2007), Guidance on using Precision Coaxial Connectors in Measurement (3ª Ed.), Teddington, Reino Unido: NPL.
- IEEE P287 (2007), IEEE Standard for Precision Coaxial Connectors (DC to 110 GHz) (Rev. 2007), New York, NY: IEEE.
- Henze A. (2010), Cables Coaxiales, Apunte de la Cátedra, UTN.
- DiVruno F., Ceconi J. (2011), Cables Coaxiales para RF y Microondas, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Times Microwave System (2007), Complete Catalog and Handbook, Catálogo TL-14, Wallingford, CT: TMS
- Andrew (1998), Selecting a Transmission Line for Your Broadcast system, SP 50115, Orland Park, IL: Andrew Co.
- RFS (2010), Coaxial Transmission Lines, Technical Information, Meriden, CT: Radio Frequency Systems.

Unidad Temática 3: Mediciones de potencia en RF y Microondas

- Hewlett Packard (1967), AN 56 - Microwave Mismatch Error Analysis, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Agilent (2001), AN 64-1C - Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2003), AN 1449-1 - Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 1), Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2006), AN 1449-2 - Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 2), Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2011), AN 1449-3 - Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 3), Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2008), AN 1449-4 - Fundamentals of RF and Microwave Power Measurements (Part 4), Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Henze A. (2010), Medición de Potencia en RF y Microondas, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Ceconi J., DiVruno F. (2010), Medición de Potencia en RF y Microondas, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Anritsu (2009), Power Meters and Power Sensors (Rev. D), Richardson, TX: Anritsu Co.
- Agilent (2009), Power Meters and Power Sensors, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Henze A. (2001), Acoplador Direccional, Buenos Aires, Buenos Aires: Universidad Nac. La Matanza.
- Henze A. (2010), Wattímetro Direccional, Apunte de la Cátedra, UTN.

Unidad Temática 4: Analizador de Redes Vectorial

- Hunton J. (1960), Analysis of Microwave Measurement Techniques by Means of Signal Flow Graphs (pp. 206-212), New York, NY: Institute of Radio Engineers.
- Henze A. (2011), Análisis de cuadripolos de 2 puertos con diagrama de flujo de señal, Apunte de la Cátedra, UTN.
- DiVruno F., Cecconi J. (2010), Parámetros S y Circuitos de Micro-Ondas, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Johnson R. (1975), Understanding Microwave Power Splitters, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Young P. (2001), Scattering Coefficients, Universidad de Kent., Kent, Reino Unido: IEE.
- Agilent (2000), AN154 - S-Parameter Design, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2008), AN 95-1 - S-Parameters Techniques, Agilent Santa Clara, CA: Tech.
- Browne J. (2007), Fundamentals of Vector Network Analysis, Munich, Alemania: Rohde & Schwarz GmbH.
- Rytting D. (1998), Network Analyzer Error Models and Calibration Methods, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Agilent (2002), AN 1287-3 - Applying error correction for VNAs (2a. Ed.), Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- TAPR / Ten Tec (2011), Manual de Instrucciones VNA modelo 6000, Sevierville, TN: Ten Tec Inc.
- Hewlett Packard (1967), Transistor Parameter Measurements, Palo Alto, CA: HP Inc.

Unidad Temática 5: Analizador de espectro

- Rauscher C. (2008), Fundamentals of Spectrum Analysis (6ª Ed.), Munich, Alemania: Rohde & Schwarz GmbH.
- Hewlett Packard (1968), AN 63 - Spectrum Analysis, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Hewlett Packard (1974), AN 150 - Spectrum Analyzer Basics, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Agilent (2006), AN150 - Fundamentals Of Spectrum Analyzers, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Hewlett Packard (1996), AN 150-1 - Spectrum Analysis AM & FM, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Hewlett Packard (1976), AN 150-11 - Spectrum Analysis- Distortion Measurements, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Agilent (2000), AN 1316 - Optimizing Spectrum Analyzer Amplitude Accuracy, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Hewlett Packard (1998), Spectrum Analyzer Basics, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Agilent (2000), Spectrum Analyzer Basics, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Cecconi J., Musolino A. (2010), Analizador de espectro, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Henze A. (2010), Analizador de espectro, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Henze A. (2010), Mediciones analizador de espectro, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Agilent (2009), Manual Analizador de Espectro N9320A, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Hewlett Packard, Especificaciones HP 8591A, Manual Service (pp. 1.9-1.21), Palo Alto, CA: HP Inc.

Unidad Temática 6: Osciloscopios de Almacenamiento Digital

- Tektronix (2005), ABCs of Probes, Beaverton, OR: Tektronix Inc.
- Tektronix (2009), TDS1000B and TDS2000B Digital Storage Oscilloscopes, Manual del Usuario, Beaverton, OR: Tektronix Inc.
- Tektronix (2001), XYZs of Oscilloscopes, Beaverton, OR: Tektronix Inc.
- Agilent (2002), AN 1420 - Understanding Oscilloscope Frequency Response and Its Effect on Rise-Time Accuracy, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2008), AN 1587 - Evaluating Oscilloscope Sample Rates vs. Sampling Fidelity: How to Make the Most Accurate Digital Measurements, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (2008), AN 1588 - Choosing an Oscilloscope with the Right Bandwidth for your Application, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Harris F. (1978), On the Use of Windows for Harmonic Analysis with the Discrete Fourier Transform, IEEE vol. 66 (pp. 51-83), New York, NY: IEEE.
- Cecconi J. (2010), Osciloscopio Digital, Apunte de la Cátedra, UTN.

Unidad Temática 7: Reflectometría en el Dominio del Tiempo

- Agilent (1990), AN62-3 - Advanced TDR Techniques, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Hewlett Packard (1964), AN62 - TDR Fundamentals for Use With the 54120T Digitizing Oscilloscope and TDR, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Johnson H. (1993), High Speed Digital Design - a Handbook of Black Magic, New York, NY: Prentice Hall Inc.
- Leddige M. (2008), Transmission Line Basics II (Class 6), Santa Clara, CA: Intel.
- Cecconi J. (2009), Reflectometría en el dominio del tiempo, Apunte de la Cátedra, UTN.

Unidad Temática 8: Contadores Digitales de Frecuencia

- Agilent (1997), AN 200-1 - Fundamentals of microwave frequency counters, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (1997), AN 200-2 - Fundamentals of Quartz Oscillators, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (1997), AN 200-3 - Fundamentals of Time Interval Measurements, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (1997), AN 200-4 - Understanding Frequency Counter Specifications, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Agilent (1997), AN 200 Series - Fundamentals of the Electronic Counters, Santa Clara, CA: Agilent Tech.
- Hewlett Packard (1974), AN 52-1 - Fundamentals of Time and Frequency Standards, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Hewlett Packard (1968), HP Journal, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Hewlett Packard (1966), HP Journal, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Hewlett Packard (1975), Manual Contador Universal HP5328A, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Cecconi J. (2009), Contadores Digitales de Frecuencia, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Musolino A., Cecconi J. (2010), Contadores Digitales de Frecuencia, Extensión del Alcance, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Hidalgo D., Cecconi J. (2009), Cálculo de Incertidumbre, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Hidalgo D., Cecconi J. (2010), Patrones de Tiempo y Frecuencia, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Musolino A., Cecconi J. (2009), Análisis de Incertidumbre en Contadores con Conversor Heterodino, Apunte de la Cátedra, UTN.

Unidad Temática 9: Sintetizadores de Frecuencia

- Hewlett Packard (1965), Manual de Service y Operaciones HP 5100A, Palo Alto, CA: HP Inc.
- Nash G. (1994), AN535D - PLL Design Fundamentals, Libertyville, IL: Motorola Inc.
- Hidalgo D., Cecconi J. (2009), Sintetizadores de Frecuencia, Apunte de la Cátedra, UTN.
- Miyara (2005), PLL - Lazos de Fijación de Fase, Rosario: Universidad Nac. Rosario.

Unidad Temática 10: Mediciones de Emisiones e Interferencias Electromagnéticas

- Red PUCARA (2009), Grupo de Compatibilidad Electromagnética, Buenos Aires: INTI.
- De Césare P., Cecconi J. (2009), Compatibilidad Electromagnética, Apunte de la Cátedra, UTN.

Unidad Temática 11: Analizadores de Estados Lógicos

- Tektronix (2008), Fundamentals of Signal Integrity, Beaverton, OR: Tektronix Inc.
- Tektronix (2006), Fundamentals of Timing Analysis, Beaverton, OR: Tektronix Inc.
- Tektronix (2008), The XYZs of Logic Analyzers, Beaverton, OR: Tektronix Inc.

Unidad Temática 12: Automatización de las Mediciones Electrónicas

- Ayuda y Tutoriales de LabView, National Instruments
- Ayuda y Toolbox "Instrument Control", Matlab

Unidad Temática 13: Mediciones en Amplificadores

- Metzler B. (2005), Audio Measurement Handbook (2a. Ed.), Beaverton, OR: Audio Precision Inc.
- Leader (1978), Manual Distorsion Meter LDM-170, Yokohama, Japón: Leader Electronics Corp.
- Manual Sinadder 3, Indialantic, FL: Help Instrumens Co.
- Musolino A., Cecconi J. (2010), Medición de Amplificadores, Apunte de la Cátedra, UTN.